超伝導回路におけるモートの最適構造及び配置の検討

Investigation on the optimum structure and placement of moats for superconducting circuits

横国大院工 ○今井 響, 山梨 裕希, 吉川 信行

Faculty of Engineering, Yokohama National Univ. °Hibiki Imai, Yuki Yamanashi,

Nobuyuki Yoshikawa

E-mail: imai-hibiki-gk@ynu.jp

1. はじめに

超伝導回路では磁束量子を伝搬し、それを信 号として入出力を行う。磁束量子の伝搬は超伝 導体で構成されるリングを経由して行うため、 外部磁束が印加されるとリングに磁束がトラ ップされ誤動作を引き起こす要因となる。そこ で超伝導回路が構成されているチップの超伝 導層にモートと呼ばれる穴を導入し、外部磁束 をそこにトラップさせることで超伝導回路へ の磁束の侵入を防ぐ方法がある[1]。高いため しかしこれまでにモートの最適な構造・配置に ついては明らかにされておらず、またモートが 回路に与える影響も深く研究されてこなかっ た。そのため本研究ではモートが超伝導回路に 与える影響の評価をシミュレーションにより 行い、モートの最適な形・レイアウトを検討し た。

2. 評価方法

本研究では CAD ツールを用いて設計した配 線・モートのインダクタンスおよび結合係数を インダクタンス成分抽出ツールである InductEx[2]を用いて算出し、モートにトラップ された磁束量子により配線にどの程度の磁束 が鎖交するか調べた。図1にシミュレーション に用いた回路のレイアウトを示す。チップ上の 超伝導回路は AIST 2.5 kA/cm² standard process2 で製作された場合、下から ground plane、BAS 層、COU層、CTL層の4層からなる。それぞ れの厚さは 500 nm、400 nm、300 nm、400 nm であり、層間の距離は400 nm、300 nm、500 nm である。今回、BAS層にループを配置すること で疑似的にモートを再現した。このとき、ルー プは超伝導回路に用いられている Nb の磁場侵 入長(80 nm)分の幅をもつ超伝導ループとみな した。この条件の下でモートと配線の距離によ って鎖交磁束の変化を求めた。各モートにはそ れぞれ 1 つずつ磁束量子がトラップされてい ると仮定した。

3. 評価結果

配線とモートとの距離を 0.5~5 μm まで変化 させた時の配線に鎖交する磁束の変化を図 3 に示す。距離に応じて鎖交磁束が減衰していることがわかる。このほかにもモートの形や数による鎖交磁束の変化のシミュレーションを行ったが、詳細は当日に発表する。

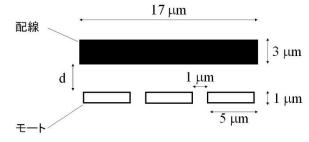
3. 謝辞

本研究は JSPS 科研費 26220904 の助成を受けたものである。さらに、チップ試作を伴う研究の場合は本研究に使用されたデバイスは、(独)産業技術総合研究所(AIST)の超伝導クリーンルーム(CRAVITY)において作製された。

4. 参考文献

[1] Kan Fujiwara et al, "Research on Effective Moat Configuration for Nb Multi-Layer Device Structure," IEEE Trans. Appl. Supercond., vol. 19, no. 3, pp. 603-606, June 2009.

[2] C. J. Fourier et al, "Three-dimensional multiterminal superconductive integrated circuit inductance extraction," Supercond. Sci. Technol., vol. 24, pp. 12015, 2011



d: 配線-モート間距離

図 1 シミュレーションに用いた配線・モートのレイアウト。配線は COU 層、モートは BAS 層にループとして配置。

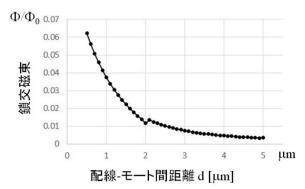


図 2 配線-モート間距離と配線に鎖交する磁束との関係